Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fuchs

Ingenieurbüro für Angewandte Spektrometrie

Engineer's Office for Applied Spectroscopy

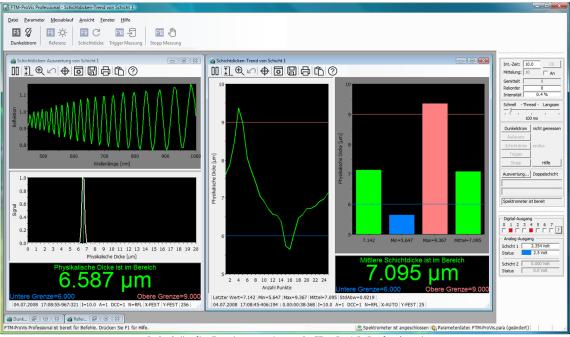


FTM-ProVis Professional

Software zur Schichtdickenmessung im Prozess

FTM-ProVis Professional basiert auf unserem FTM-ProVis Lite Softwarepaket und wurde zur Dickenmessung von dünnen transparenten Schichten mit unseren **TranSpec** Systemen speziell für die Anforderungen in der Prozess-Messtechnik erweitert.

So unterstützt die Software zum Beispiel ein- und dreiachsige Traversen zur koordinatengesteuerten Messung des Dickenprofils, zum Beispiel auf Beschichtungsanlagen. Gleichzeitig können dabei die gemessene Schichtdicke und umfangreiche Statusinformationen auf digitalen und analogen Schnittstellen ausgegeben werden, wodurch eine direkte Prozesskontrolle möglich wird.



Beispielhafte Fensteranordnung in FTM-ProVis Professional

FTM-ProVis Professional verwendet einen speziell entwickelten Fast-Fourier-Transformation (FFT) Algorithmus zur Bestimmung der Schichtdicke aus Interferenzspektren von dünnen, transparenten Schichten. Das Schichtdickenergebnis wird in Echtzeit berechnet, in verschiedenen Online-Grafiken dargestellt und kann während des Messablaufs in eine Textdatei gespeichert oder optional als analoger Spannungswert ausgegeben werden.

Technische Spezifikationen auf der nächsten Seite ▶

DE-73430 Aalen Bischof-Fischer-Str. 108 Telefon: 07361 - 97 53 28 0 Telefax: 07361 - 97 53 28 5

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fuchs

Ingenieurbüro für Angewandte Spektrometrie

Engineer's Office for Applied Spectroscopy



FTM-ProVis Professional Software - Technische Daten

Mai 2025, bezogen auf Version 6.1, alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten

Hardware- und Softwarevoraussetzung

- Standard PC/Laptop mit Windows 10
- Bildschirm mit wenigstens Full-HD, eine höhere Auflösung wird empfohlen
- TranSpec Prozess-Spektrometer mit integrierter Halogenlampe oder Deuterium-/Halogenlampe

Allgemeine Beschreibung

- Multi-Threaded MDI-Applikation
- Automatische Dokument-Registrierung "drag-and-drop" der FTM-ProVis Professional Dokumentdateien
- Minimaler Ressourcen- und Speicherbedarf
- Vollständig in Visual C++ unter Verwendung der "Microsoft Foundation Classes" (MFC) programmiert
- Berücksichtigung des Microsofts "Application Design Guides": Symbolleiste, Statuszeile, Online-Hilfe
- Unterstützt Windows Skalierung und Multi-Monitor Benutzung
- Ausführliches, in Farbe gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch und als PDF
- Nur in Englisch erhältlich

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren TranSpec Schichtdicken-Messgeräten und der FTM-ProVis Professional Software grundsätzlich messbare Schichtdickenbereich beträgt circa 0.2-120 Mikrometer, hängt aber wesentlich vom Spektralbereich und der spektralen Auflösung des verwendeten Spektrometermoduls ab. Daneben bestimmen noch andere Faktoren den tatsächlich messbaren Schichtdickenbereich, wie etwa der Brechungsindex und dessen Dispersion, sowie der aktuell gewählte spektrale Auswertebereich des Interferenzspektrums.

Hochgenaues und schnelles Auswerteverfahren, auch für Doppelschichten

- Auswertung der Interferenz über eine spezielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)
- Laufzeitoptimierter Algorithmus, die Auswertezeit pro Spektrum ist deutlich unter einer Millisekunde
- Neues Verfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Peaklage (Schichtdicke)
- Frei wählbarer spektraler Auswertebereich im Interferenzspektrum
- Berücksichtigung von Brechungsindex und Dispersion (Cauchy Dispersionskorrektur)
- Wählbarer FFT-Auswertebereich zur simultanen Bestimmung der Dicke von Doppelschichten

Vielfältige Möglichkeiten zur Messung und Visualisierung der Schichtdicke

- Unterstützung von dreiachsigen Traversieranlagen für koordinatengesteuerte, vollautomatische Messung von rechteckigen Schichtdickenprofilen mit bis zu 300 x 300 Messpunkten
- Unterstützung von einachsigen Traversen für kontinuierliche Dickenmessung in Querrichtung zur Maschine
- Unterstützung von mehrkanaligen Lichtleiter-Multiplexer oder echtem Transpec 2-Kanal Spektrometer
- Digitale Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken-Grenzwertüberschreitung auf 8-fach TTL
- Analoge Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken als 0-10 Volt auf 4-fach Analogschnittstelle
 Manuell oder vollautomatisch getriggerte Messabläufe möglich, Trigger-Signal über Zeit, extern TTL oder Traverse
- Echtzeit-Darstellung der Interferenz- und FFT-Spektren während der Messung
- Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als Trend- und Balkengrafik
- Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als 3D-Profilgrafik
- Speichert w\u00e4hrend des Messablaufs bis zu 100.000 Schichtdickenwerte in eine Textdatei
- Speichert bis zu 100.000 Spektren als Spektren-Rekorderdatei für nachträgliche ("offline") Auswertung
- Speichern und Laden von Parameterdateien für Messabläufe und Auswertung, auch Passwortgeschützt
- Schneller Zugriff auf zuletzt benutze Parameter- und Spektren-Rekorderdateien

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingetragenes Warenzeichen des Ing.-Büros für Angewandte Spektrometrie, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fuchs. Alle sonstigen Produktnamen sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

DE-73430 Aalen Telefon: 07361 - 97 53 28 0 Web: www.angewandte-spektrometrie.de
Bischof-Fischer-Str. 108 Telefax: 07361 - 97 53 28 5 Email: sales@angewandte-spektrometrie.de